

# FTS2000

## 电子器件老化测试实验系统



### 特点

- 动态测试；
- 测试精度高；
- 采集速度快；
- 开放式软件，可根据需求实现硬件设备的增加、调整、配置；
- 模块化设计，易于维护；
- 紧凑的结构设计，可配合高低温箱开展实验；
- 高性能、低纹波噪音程控电源；
- 自适应恒压或恒流输出，自动切换工作状态；
- 时序控制功能，可自定义每一路电源输出大小和时间工步；
- 实时监测通道数据、图形化显示设备信息、测试数据的记录保存与调用，导出成Excel文件保存。

### 系统软件

FTS2000系统根据客户需求，为使用者提供了一套适合于广泛应用的开放式软体架构。用户可编辑测试步骤，同时控制单台或多台测试设备。

- 开放式软件，可根据需求实现硬件设备的增加、调整、配置；
- 可编辑每通道电源的电压电流和运行时序，实现复杂带载测试；
- 可记录每个试验通道的测试数据，并绘制输出曲线和Excel 数据报告，确保试验数据可追溯；
- 可显示每通道的电压、电流，运行时序等实时信息；
- 可显示每个试验通道试验器件型号、老化状态、老化进程、监视状态、报警状态、器件库信息等，全面反映系统试验总体进程和状况。



### 简述

FTS2000电子器件老化测试实验系统，是费思针对各种分立元件，电源模块，继电器，接触器，线束，保险丝等电子器件及产品的动态老化测试，包括：可靠性实验、寿命试验、性能指标实验等应用而开发的实验系统。

系统搭配费思的各型高精度的直流电源和电子负载以及费思的系列数据采集控制板卡，搭配各类高低温试验箱及测试仪器，系统可实现对元器件的加速老化测试。

测试系统操作简便，可对多个分组批量的电子器件产品同时动态加电、拉载、控制，进行长时间的、连续的测试控制，及数据统计分析。

系统的架构具有良好的扩展性，配置灵活度高,可提供定制的测试项，帮助各类用户轻松完成复杂的实验。

### 推荐测试仪器

#### 直流电源

- FTL多路电源  
输出范围（单机）：0~600V/0~110A/0~1500W



- FTP3000系列  
输出范围（单机）：0~600V/0~80A/0~1500W



- FTP系列  
输出范围（单机）：0~1500V/0~240A/0~6500W



#### 直流电子负载

- FT6400系列  
输出范围（单机）：0~1200V/0~2100A/0~6kW



- FT6100A多路负载  
输出范围（单路）：0~500V/0~120A/0~1080W



#### 测量附件

- FTM8000系列数据采集控制系统  
可提供继电器控制、电压测量、数字I/O信号

